

機器分析センター登録機器一覧

*=センター内設置

部門	機種名	設置場所	専門員	管理者
構造解析部門	高分解能質量分析装置 MS	*有機物構造解析室	柘植	岡本
	飛行時間型質量分析装置 TOF-MS	*有機物構造解析室	荒木	国末
	核磁気共鳴装置 I 500M NMR	* //	北村	国末
	核磁気共鳴装置 II 400M NMR	* //	荒木	国末
	固体NMR 300M (休止中)	* //	—	国末
	広帯域固体NMR	研究教育7号棟	出口	—
	新素材及び複合材料微細構造解析装置 (TEM)	*微細構造解析室	石丸	若山
	集束イオンビーム装置(FIB)	* //	石丸	若山
	CCD搭載全自動単結晶構造解析装置 (低温窒素吹き付け装置付き)	* X線構造解析室	岡内	—
全自動水平型多目的X線回折装置 (XRD)	* //	堀部	山本	
原子・分子構造解析部門	電子スピン共鳴装置 ESR	研究教育7号棟	出口	—
	汎用基礎物性測定装置 I : SQUID	*基礎物性測定室	美藤	—
	光散乱光度計	*分光分析室	毛利	—
	汎用基礎物性測定装置 II : SQUID	*基礎物性測定室	美藤	—
生体機能解析部門	共焦点レーザー顕微鏡	情報工学部 研究棟西7階	引間	—
	円二色性分散計		大内	—
	TOF質量分析計 TOF-MS		坂本(順)	—
	蛍光分光光度計		末田	—
	プロテインシーケンサー		前田	山崎
	FT-IR		大内	—
表面及び界面解析部門	全自動ガス吸着量測定装置 (BET)	*分光分析室	高瀬	—
	結晶方位測定解析装置+EDS	* X線元素分析室	山口	三好
	3次元走査型電子顕微鏡+EDS	* //	山口	山本
	超微小押し込み硬さ試験機	*クリーンルーム	松田	—
	FE-SEM JSM-6320F	総合研究3号棟	—	—
	FE-SEM JSM-6701F	* X線元素分析室	横野	—
	X線光電子分光分析装置AXIS-Nova	*表面分析室	横野	武尾
元素分析部門	蛍光X線分析装置 XRF	* X線構造解析室	大坪	山本
	有機元素分析装置 CHN	*元素分析室1	—	武尾
	ICP発光分光分析装置 ICP	*元素分析室2	高須	伊藤
	炭素・硫黄同時分析装置 CS	*元素分析室2	—	埋金
	原子吸光光度計	*試料準備室	—	—
	X線マイクロアナライザーJXM 8900	総合研究3号棟	—	—
	FE-E PMA (JEOL)	* X線構造解析室	恵良	三好
	X線分析顕微鏡 (堀場製作所XGT-5000Type II)	* X線構造解析室	—	山本
試料作成・データ処理部門	示差熱天秤・示差走査熱量計TG・DTA・DSC	*温熱環境試験室	坪田	—
	ワークステーション WS	*微細構造解析室	—	若山
	卓上型高周波溶解炉	*教官実験室	大坪	—
	アークメルト溶解炉	*試料作成室	—	—
	熱電特性評価装置 ZEM-1	//	大坪	—
	遊星ボールミル	//	大坪	—
	卓上万能試験機 島津EZ Test	宇宙環境技術ラボラトリ	岩田(稔)	—
	液体窒素タンク	*容器保管庫	—	国末
	高温型赤外線真空炉 (サモ理工IVF298W)	*試料作成室	大坪	—
	高機能型熱画像計測装置 (サーモビジョン:チノ)	* X線構造解析室	—	—